09/393,966 Filed: 9/10/99 Seiji Takeuch; et al.

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年 9月 9日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第255658号

キヤノン株式会社

1999年10月 1日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office



特平11-255658

【書類名】

特許願

【整理番号】

4059026

【提出日】

平成11年 9月 9日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02B 5/18

【発明の名称】

光学素子及びそれを有した光学系

【請求項の数】

36

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

竹内 誠二

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

田中 一郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会

社内

【氏名】

富田 泰行

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】

キヤノン株式会社

【代表者】

御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】

100086818

【弁理士】

【氏名又は名称】

高梨 幸雄

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

平成10年特許願第276615号

特平11-255658

【出願日】

平成10年 9月11日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009623

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9703877

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学素子及びそれを有した光学系

【特許請求の範囲】

【請求項1】 有効領域の周辺領域に、金属より成る遮光部を設けたことを 特徴とする光学素子。

【請求項2】 前記遮光部は反射防止処理を施した金属であることを特徴と する請求項1記載の光学素子。

【請求項3】 前記遮光部は低反射Cr すなわち酸化Cr とCr の積層膜であることを特徴とする請求項2記載の光学素子。

【請求項4】 光学素子の有効領域の周辺領域に、薄膜セラミック材料より成る遮光部を設けたことを特徴とする光学素子。

【請求項5】 前記セラミック材料がTiC, TiN, ZrC, HfC, Hf

【請求項6】 前記セラミック材料は使用波長を吸収するものであることを 特徴とする請求項4の光学素子。

【請求項7】 前記遮光部にはアライメントマークが設けられていることを 特徴とする請求項1から6のいずれか1項の光学素子。

【請求項8】 光学素子の周辺領域に、遮光インクより成る遮光部とアライメントマークを設けたことを特徴とする光学素子。

【請求項9】 前記遮光部とアライメントマークはともに印刷により施していることを特徴とする請求項7又は8の光学素子。

【請求項10】 使用光に印刷で用いる遮光インクが晒される部分が外部に露出していないことを特徴とする請求項9記載の光学素子。

【請求項11】 有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該 遮光領域は、波長250nm以下の紫外線レーザー光を遮光すると共に該紫外線 レーザー光により好ましくない物質を発生させないことを特徴とする光学素子。

【請求項12】 有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該 遮光領域は紫外線を遮光すると共に該紫外線により好ましくない物質を発生させ ないことを特徴とする光学素子。

【請求項13】 有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該 遮光領域は、放射エネルギを遮光すると共に該放射エネルギにより好ましくない 物質を発生させないことを特徴とする光学素子。

【請求項14】 有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該 遮光領域は、波長250nm以下の紫外線レーザー光を遮光すると共に該レーザ ー光に耐性を有することを特徴とする光学素子。

【請求項15】 有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該 遮光領域は紫外線を遮光すると共に該紫外線に耐性を有することを特徴とする光 学素子。

【請求項16】 有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該 遮光領域は、放射エネルギを遮光すると共に該放射エネルギに耐性を有すること を特徴とする光学素子。

【請求項17】 前記遮光領域は金属又は薄膜セラミック又は半導体の少なくとも1つより成ることを特徴とする請求項11~16のいずれか1項の光学素子。

【請求項18】 非有効領域に無機材料より成る遮光部を設けたことを特徴とする光学素子。

【請求項19】 非有効領域に光を遮るとともに、該光により好ましくない物質を発生させない遮光部を設けたことを特徴とする光学素子。

【請求項20】 使用波長が250nm以下であることを特徴とする請求項18又は19記載の光学素子。

【請求項21】 前記遮光部の材料は、金属材料であることを特徴とする請求項18から請求項20記載のいずれか1項の光学素子。

【請求項22】 前記遮光部は、反射防止処理を施した金属であることを特徴とする請求項21記載の光学素子。

【請求項23】 前記遮光部の材料は、クロム、アルミ、モリブデン、タンタル、タングステンのいずれかであることを特徴とする請求項21または請求項22記載の光学素子。

特平11-255658

【請求項24】 前記反射防止処理は、金属酸化物層を前記遮光部に積層した構造であることを特徴とした請求項22の光学素子。

【請求項25】 前記金属酸化物層は酸化クロム,酸化シリコン,酸化アルミニウムのいずれかであることを特徴とする請求項24記載の光学素子。

【請求項26】 前記遮光部の材料は、金属とシリコンの化合物材料である ことを特徴とする請求項18から請求項20記載の光学素子。

【請求項27】 前記遮光部の材料は、モリブデン, タングステンのいずれかとシリコンの化合物であることを特徴とする請求項26記載の光学素子。

【請求項28】 前記遮光部の材料は、半導体材料であることを特徴とする 請求項18から請求項20記載のいずれか1項の光学素子。

【請求項29】 前記遮光部の材料はシリコンであることを特徴とする請求項28記載の光学素子。

【請求項30】 前記遮光部の材料は、金属酸化物材料であることを特徴と する請求項18から請求項20記載のいずれか1項の光学素子。

【請求項31】 前記遮光部の材料は酸化チタンであることを特徴とする請求項35記載の光学素子。

【請求項32】 前記光学素子は回折光学素子であることを特徴とする請求項1から31のいずれか1項の光学素子。

【請求項33】 請求項1から32のいずれか1項の光学素子を有していることを特徴とする光学系。

【請求項34】 請求項1から32のいずれか1項の光学素子を含む光学系を介した光束を利用して所定面上を照明していることを特徴とする照明装置。

【請求項35】 請求項1から32のいずれか1項の光学素子を含む光学系を介した光束を利用して第1物体面上のパターンを照明し、該第1物体面上のパターンを投影光学系により基板面上に投影露光していることを特徴とする投影露光装置。

【請求項36】 請求項1から32のいずれか1項の光学素子を含む光学系を介した光束を利用してマスク面上のパターンを照明し、該パターンでウエハ面を露光した後に、該ウエハを現像処理工程を介してデバイスを製造していること

を特徴とするデバイスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、回折光学素子等の光学素子及びそれを有した光学系に関し、例えば、被写体を感光体面上に形成する為のカメラに用いられる結像光学系、感光ドラム面上を光走査してその面上に画像情報を形成する為の画像形成用光学系、IC、LSI等の半導体素子などのデバイスを製造する際に第1物体としてのマスク上の電子回路パターンを投影レンズなどの投影光学系により第2物体としてのウエハ上に投影するときの投影光学系、そしてこの投影のために該マスクを照明する為の照明光学系等に好適なものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、光の回折現象を利用した回折光学素子を用いた光学系が種々と提案されている。回折光学素子としては、例えばフレネルゾーンプレート, キノフォーム, バイナリオプティックス, ホログラム等が知られている。

[0003]

回折光学素子は、入射波面を定められた波面に変換する光学素子として用いられている。この回折光学素子は屈折光学素子にはない特長を持っている。例えば、屈折光学素子と逆の分散を示すこと、実質的には厚みを持たないので光学系がコンパクトになること等の特長を持っている。

[0004]

一般に、回折光学素子の形状として、例えばバイナリ型の形状にするとその作製に半導体素子の製造技術が適用可能となり、微細なピッチも比較的容易に実現することができる。この為、ブレーズド形状を階段形状で近似したバイナリ型の回折光学素子に関する研究が最近盛んに進められている。

[0005]

図22から図24は各々、従来の回折光学素子の要部概略図である。

[0006]

図22はフレネルゾーンプレートであり、ガラス基板上にクロム等の金属膜を蒸着し、リソグラフィープロセスなどによりフレネルゾーンを描画することで金属膜等が残る遮光部と膜のない透光部を形成している。図23は輪帯の半径方向の周期構造の1周期が連続的な曲面をなしているフレネルレンズ(キノフォーム)の断面図であり、切削やプレス加工で形成している。図24はバイナリ型の回折光学素子であり、ガラス基板の表面を複数回のリソグラフィープロセスによって階段状に加工した位相型の回折格子より成っている。

[0007]

図25から図27は、従来の回折光学素子を有した光学鏡筒の要部断面図である。

[0008]

図25は回折光学素子2501を鏡筒2502にはめたもので回折光学素子2501の有効径 φ と鏡筒2502の有効径Dがほぼ同じ径である。図26は図25と同様に回折光学素子2601を鏡筒2602にはめたもので回折光学素子2601の有効径 φ が鏡筒2602の有効径Dより大きいものである。図27は回折光学素子2701の周辺部を切削加工等により回折光学素子として機能する部位の外周部分近傍まで削ったものである。尚、2702は鏡筒である。

[0009]

一方、回折光学素子に光を入射させたとき回折格子以外の領域に光束が入射するとそこからノイズ光が生じ、光学特性が低下する。

[0010]

そこで特開昭62-250401号公報や特開平4-95233号公報では回 折格子の有効領域外に遮光膜を施した回折光学素子を提案している。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

回折光学素子を光学系の一部に用いると前述した各種の利点が得られる。しかしながら、例えば図25に示すような回折光学素子は、その有効径と鏡筒の有効径をあわせて組み立てることが難しく、回折光学素子の回折作用の無い部位が鏡筒の有効径内に存在する状態となり、不要光Aが発生する要因となった。その一

方で図26のように回折光学素子の有効径を鏡筒の有効径より大きくする場合、 周辺部の光が通過しない部分の加工のために要するマスクのEB描画など加工の 費用など無駄が多いという問題があった。また、図27に示すような回折光学素 子ユニットは回折格子部に近い部分を切削するため切削時に発生する微細な塵や 異物2703が周辺部に付着し、散乱等を発生する原因となっている。

[0012]

従来の回折光学素子はいずれの場合も不要光や散乱光を発生し、良好な回折光 学素子やそれを用いた光学系を製作することができないという課題があった。

[0013]

先の特開昭62-250401号公報や特開平4-95233号公報で提案されている回折光学素子は有効領域の周囲に遮光膜を施してノイズ光の発生を防止しているが、遮光膜の詳しい構成については開示していない。

[0014]

この種の遮光材料は、適切な素材を選定しないと、紫外線照射により材料から 好ましくない物質が出たり、該材料よりのアウトガスが紫外線等に分解され、好 ましくない物質が生じレンズの曇等が発生し、露光装置の寿命低下をひきおこす 。特に光がダイレクトにあたる遮光部材は影響が大きい。

[0015]

本発明は、回折光学素子などの光学素子等を構成する遮光部を適切に設定することにより、不要光や錯乱光の発生が少なく、製作が容易でしかも光学性能を良好に維持することができる回折光学素子などの光学素子及びそれを有した光学系の提供を目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】

請求項1の発明の光学素子は、

有効領域の周辺領域に、金属より成る遮光部を設けたことを特徴としている。

[0017]

請求項2の発明は請求項1の発明において、

前記遮光部は反射防止処理を施した金属であることを特徴としている。

[0018]

請求項3の発明は請求項2の発明において、

前記遮光部は低反射Crすなわち酸化CrとCrの積層膜であることを特徴としている。

[0019]

請求項4の発明の光学素子は、

光学素子の有効領域の周辺領域に、薄膜セラミック材料より成る遮光部を設け たことを特徴としている。

[0020]

請求項5の発明は請求項4の発明において、

前記セラミック材料がTiC, TiN, ZrC, HfC, HfNのいずれか、あるいはその組み合わせであることを特徴としている。

[0021]

請求項6の発明は請求項4の発明において、

前記セラミック材料は使用波長を吸収するものであることを特徴としている。

[0022]

請求項7の発明は請求項1から6のいずれか1項の発明において、

前記遮光部にはアライメントマークが設けられていることを特徴としている。

[0023]

請求項8の発明の光学素子は、

光学素子の周辺領域に、遮光インクより成る遮光部とアライメントマークを設けたことを特徴としている。

[0024]

請求項9の発明は請求項7又は8の発明において、

前記遮光部とアライメントマークはともに印刷により施していることを特徴と している。

[0025]

請求項10の発明は請求項9の発明において、

使用光に印刷で用いる遮光インクが晒される部分が外部に露出していないこと

を特徴としている。

[0026]

請求項11の発明の光学素子は、

有効領域の周囲に遮光領域とを有する光学素子において、該遮光領域は、波長 250 n m以下の紫外線レーザー光を遮光すると共に該紫外線レーザー光により 好ましくない物質を発生させないことを特徴としている。

[0027]

請求項12の発明の光学素子は、

有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該遮光領域は紫外線を 遮光すると共に該紫外線により好ましくない物質を発生させないことを特徴とし ている。

[0028]

請求項13の発明の光学素子は、

有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該遮光領域は、放射エネルギを遮光すると共に該放射エネルギにより好ましくない物質を発生させないことを特徴としている。

[0029]

請求項14の発明の光学素子は、

有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該遮光領域は、波長250nm以下の紫外線レーザー光を遮光すると共に該レーザー光に耐性を有することを特徴としている。

[0030]

請求項15の発明の光学素子は、

有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該遮光領域は紫外線を 遮光すると共に該紫外線に耐性を有することを特徴としている。

[0031]

請求項16の発明の光学素子は、

有効領域の周囲に遮光領域を有する光学素子において、該遮光領域は、放射エネルギを遮光すると共に該放射エネルギに耐性を有することを特徴としている。

[0032]

請求項17の発明は請求項11~16のいずれか1項の発明において、

前記遮光領域は金属又は薄膜セラミック又は半導体の少なくとも1つより成る ことを特徴としている。

[0033]

請求項18の発明の光学素子は、

非有効領域に無機材料より成る遮光部を設けたことを特徴としている。

[0034]

請求項19の発明は、

非有効領域に光を遮るとともに、該光により好ましくない物質を発生させない 遮光部を設けたことを特徴としている。

[0035]

請求項20の発明は請求項18又は19の発明において、

使用波長が250nm以下であることを特徴としている。

[0036]

請求項21の発明は請求項18から20のいずれか1項の発明において、

前記遮光部の材料は、金属材料であることを特徴としている。

[0037]

請求項22の発明は請求項21の発明において、

前記遮光部は、反射防止処理を施した金属であることを特徴としている。

[0038]

請求項23の発明は請求項26又は21の発明において、

前記遮光部の材料は、クロム、アルミ、モリブデン、タンタル、タングステン のいずれかであることを特徴としている。

[0039]

請求項24の発明は請求項22の発明において、

前記反射防止処理は、金属酸化物層を前記遮光部に積層した構造であることを 特徴としている。

[0040]

請求項25の発明は請求項24の発明において、

前記金属酸化物層は酸化クロム、酸化シリコン、酸化アルミニウムのいずれかであることを特徴としている。

[0041]

請求項26の発明は請求項18から20のいずれか1項の発明において、

前記遮光部の材料は、金属とシリコンの化合物材料であることを特徴としている。

[0042]

請求項27の発明は請求項26の発明において、

前記遮光部の材料は、モリブデン、タングステンのいずれかとシリコンの化合物であることを特徴としている。

[0043]

請求項28の発明は請求項18から20のいずれか1項の発明において、 前記遮光部の材料は、半導体材料であることを特徴としている。

[0044]

請求項29の発明は請求項28の発明において、

前記遮光部の材料はシリコンであることを特徴としている。

[0045]

請求項30の発明は請求項18から20のいずれか1項の発明において、

前記遮光部の材料は、金属酸化物材料であることを特徴としている。

[0046]

請求項31の発明は請求項20の発明において、

前記遮光部の材料は酸化チタンであることを特徴としている。

[0047]

請求項32の発明は請求項1から31のいずれか1項の発明において、

前記光学素子は回折光学素子であることを特徴としている。

[0048]

請求項33の発明の光学系は請求項1から32のいずれか1項の光学素子を有していることを特徴としている。

[0049]

請求項34の発明の照明装置は請求項1から32のいずれか1項の光学素子を含む光学系を介した光束を利用して所定面上を照明していることを特徴としている。

[0050]

請求項35の発明の投影露光装置は請求項1から32のいずれか1項の光学素子を含む光学系を介した光束を利用して第1物体面上のパターンを照明し、該第1物体面上のパターンを投影光学系により基板面上に投影露光していることを特徴としている。

[0051]

請求項36の発明のデバイスの製造方法は請求項1から32のいずれか1項の 光学素子を含む光学系を介した光束を利用してマスク面上のパターンを照明し、 該パターンでウエハ面を露光した後に、該ウエハを現像処理工程を介してデバイ スを製造していることを特徴としている。

[0052]

【発明の実施の形態】

図1(A)、(B)は本発明の回折光学素子を有した光学鏡筒の実施形態1の要部正面図と要部断面図である。図中、1は回折光学素子であり、バイナリ形状(階段形状)やキノフォーム形状、そしてフレネル形状等の断面形状をもつ回折格子を設けた格子部101と格子部101の外側周囲(光学的に非有効領域)に、一定の幅で、回折格子101が形成されている面側に設けた遮光部103とを有している。遮光部103は金属やセラミックや薄膜セラミック、そして半導体のいずれか1つより成る紫外線などのエネルギ照射によって好ましくない物質を生成しない特性を有した構成より成っている。102は鏡筒(保持枠)であり、回折光学素子1を保持している。

[0053]

φは回折光学素子1の格子部101の有効口径、dは回折光学素子1の口径、 Dは鏡筒102の開口口径を示している。本実施形態は口径中の範囲内に入射した光が透過する透過型の回折光学素子1として示しているが口径中の範囲内に入 射した光を反射する。この範囲に反射膜のある反射型の素子であってもよい。

[0054]

次に、本実施形態の回折光学素子1の製造方法を図2から図9を用いて説明する。この製造にはいわゆるリソグラフィー技術が用いられる。

[0055]

本実施形態では、基板上に遮光部の材料としての低反射クロムを形成した後, 4 段の階段形状より成る回折格子を有する回折光学素子を作製する工程を述べる

[0056]

低反射ブラッククロム層205はクロム層と酸化クロム層よりなり、クロム層 / 酸化クロム層あるいは酸化クロム層/クロム層の2層、または、図2に示すようにクロム層203を酸化クロム層202、204で挟みこんだ3層よりなる。 遮光部の層構成は要求される低反射の度合に応じて選択する。本実施形態では3 層の場合について述べる。

[0057]

図2に示すように、まず透明な石英基板201上に、酸化クロム膜202(CrOx)をスパッタリング法により300Å形成し、続いてクロム膜203(Cr)をスパッタリング法により1000Å形成する。さらに引き続き酸化クロム膜204(CrOx)をスパッタリング法により300Å形成する。

[0058]

次に低反射クロム層205の一部に以後のアライメントの基準となるアライメントマーク301を形成する。これにはまずフォトレジストをスピンコートしアライメントマークとなる部分のみ、低反射Crが露出するようにした後、反応性イオンエッチング法により酸化クロム204を除去する。このとき例えばエッチングガスとして塩素ガス、あるいは塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いてエッチングしている。またCr層がのこれば、オーバーエッチングしてもよい。続いてフォトレジストを剥離する。この状態の模式図を図3に示す。

[0059]

次にフォトレジストをスピンコートし、遮光部103となる部分のみ、低反射

Crが露出しないようにパターン(レジストパターン)401を形成する。この 状態の模式図を図4に示す。反応性イオンエッチング法により,上層の酸化クロ ム層204,クロム層203および下層の酸化クロム層202を除去する。この とき例えばエッチングガスとして塩素ガス、あるいは塩素ガスと酸素ガスの混合 ガスを用いてエッチングしている。続いてフォトレジスト401を剥離する。こ の状態の模式図を図5に示す。

[0060]

次に格子部101のエッチング工程に移る。

[0061]

図5の状態の基板201にフォトレジストを塗布し、第一回目のレジストパターン601を形成する。この状態の模式図を図6に示す。続いてレジストパターン601をマスクに石英基板201を2440Åエッチングする。その後レジストパターン601を剥離する。続いて基板201にフォトレジストを塗布し、第二回目のレジストパターン701を形成する。この状態の模式図を図7に示す。続いてレジストパターン701をマスクに石英基板201を1220Åエッチングする。この状態の模式図を図8に示す。最後にフォトレジストパターン701を剥離して図9に示す遮光部103を回折面に有する回折光学素子1を製造している。あとは図1のようにこの回折光学素子1を鏡筒102もしくはこれに類する鏡筒に設置するのみである。鏡筒102と回折光学素子1の高精度な芯出しが要求される場合には、鏡筒102に設置する際にプロセスで用いたアライメントマーク301を利用して鏡筒102と回折光学素子1の芯出しを容易にしている

[0062]

また、この低反射Crのようにメタルあるいはそれと無機材料との組み合わせより成る部材を用いれば、光照射によるアウトガスが少なく、レンズの曇がなく装置寿命が向上する。

[0063]

尚、本発明の回折光学素子などの光学素子において、有効領域101の周囲の 遮光領域(遮光部)103は次のうちの少なくとも1つの特性を有する構成より 成っている。

(7-1)波長250nm以下の紫外線レーザー光を遮光すると共に該レーザー光により好ましくない物質を発生させない。

(アー2)紫外線を遮光すると共に該紫外線により好ましくない物質を発生させない

(アー3)放射エネルギを遮光すると共に該放射エネルギにより好ましくない物質を 発生させない。

(7-4)波長250nm以下の紫外線レーザー光を遮光すると共に該レーザー光に耐性を有する。

(7-5)紫外線を遮光すると共に該紫外線に耐性を有する。

(7-6)放射エネルギを遮光すると共に該放射エネルギに耐性を有する。

[0064]

次に本発明の回折光学素子の実施形態2の製造方法について図10から図16 を用いて説明する。この製造にも前述のリソグラフィー技術が用いられる。

[0065]

本実施形態は遮光部を実施形態1同様に低反射クロムとするが、作製方法として4段の階段形状より成る回折格子を有する回折光学素子を作製した後に、遮光部を形成するものである。図10から16は本実施形態の作製方法の途中工程を示している。

[0066]

石英基板1001にフォトレジストを塗布し、第一回目のレジストパターン1002を形成する。またこの後の工程の基準となるアライメントマーク用のレジストパターン1003も同時に形成する。この状態の模式図を図10に示す。続いてレジストパターン1002をマスクに石英基板1001を2440Åエッチングする。この状態の模式図を図11に示す。続いて基板1001にフォトレジストを塗布し、第二回目のレジストパターン1204を形成する。続いてレジストパターン1204をマスクに石英基板1001を1220Åエッチングする。この状態の模式図を12に示す。最後にフォトレジストパターン1204を剥離して図13に示す回折光学素子1の格子部が完成する。

[0067]

次に図13に示す基板1001に酸化クロム膜1405 (CrOx)をスパッタリング法により300Å形成し、続いてクロム膜1406 (Cr)をスパッタリング法により1000Å形成する。さらに引き続き酸化クロム膜1407 (CrOx)をスパッタリング法により300Å形成する。この状態の模式図を図14に示す。

[0068]

次にフォトレジストをスピンコートし、遮光部103のみマスクされるように パターン1501を形成する。この状態の模式図を図15に示す。

[0069]

反応性イオンエッチング法により、格子部領域に塗布した上層の酸化クロム層 1407、クロム層 1406および下層の酸化クロム層 1405を除去する。このとき例えばエッチングガスとして塩素ガス、あるいは塩素ガスと酸素ガスの混合ガスを用いてエッチングしている。続いてフォトレジスト1501を剥離する。この状態の模式図を図16に示す。このようにして遮光部103を回折面に施した回折光学素子1を製造している。

[0070]

あとは図1のようにこの回折光学素子1を鏡筒102もしくはこれに類する鏡筒に設置するのみである。鏡筒102と回折光学素子1の高精度な芯出しが要求される場合には、鏡筒102に設置する際にプロセスで用いたアライメントマークを利用して鏡筒102と回折光学素子1の芯出しを容易にしている。

[0071]

次に本発明の回折光学素子の実施形態3の製造方法について図28から図35 を用いて説明する。

[0072]

本実施形態は、作製方法として4段の階段形状より成る回折格子を有する回折 光学素子を作製した後に、遮光部を形成している。図28から図35は本実施形 態の作製方法の途中工程を示している。

[0073]

石英基板1001にフォとレジストを塗布し、第一回目のレジストパターン1002を形成する。またこの後の工程の基準となるアライメントマーク用のレジストパターン1003も同時に形成する。この状態の模式図を図28に示す。続いてレジストパターン1002をマスクに石英基板1001を1854Åエッチングする。この状態の模式図を図29に示す。続いて基板1001にフォトレジストを塗布し、第二回目のレジストパターン1204をマスクに石英基板1001を927Åエッチングする。この状態の模式図を図30に示す。最後にフォトレジストパターン1204を剥離して図31に示す回折光学素子1の格子部が完成する。

[0074]

上記エッチング深さは、使用波長193nmに最適化されたものである。

[0075]

次にフォトレジストをスピンコートし、フォトレジスト層aを形成する。この 状態を図32に示す。

[0076]

次にアライメントマークcを用いてアライメントを行いちょうど素子部のみにフォトレジストパターンbがかかるように、露光、現像を行う。この状態を図3 3に示す。

[0077]

次にスパッタリング法により、アルミ膜 d を 1 0 0 0 オングストローム成膜する。この状態を図34に示す。

[0078]

ここではアルミ膜を用いたが、スパッタリングのターゲットを変更することで、アルミのかわりにモリブデン、タンタル、タングステン、モリブデンシリサイド、タングステンシリサイド、シリコン、酸化チタンのうちのいずれかの材料を成膜しても、この後の工程に変わりはない。これらの材料は光の波長193nm付近での吸収が大きく、あるいは反射が大きいため、十分遮光膜として機能する

[0079]

次にレジストの剥離液を用い、リフトオフ法により素子上のアルミ膜とフォトレジスト膜を同時に除去する。この時リフトオフしにくければ、スクラバーを併用してもよい。リフトオフが完了して遮光部付の素子が完了する。この状態を図35に示す。

[0080]

以上のように本実施形態の光学素子はその周辺領域に無機材料より成る遮光部 103を設けている。

[0081]

ここで、遮光部103は光学素子を用いるときの使用波長(250nm以下の光)に対して、

- (イ-1)低吸収であること。
- (4-2) 高反射であること。

である。

[0082]

又遮光部103の材料は、

- (ウ-1)金属材料であること。
- (ウー2)クロム, アルミ, モリブデン, タンタル, タングステンのいずれかであること。
- (ウ-3)金属とシリコンの化合物であること。
- (ウ-4)モリブデン、タングステンのいずれかとシリコンの化合物であること。
- (ウ-5)半導体材料であること。
- (ウ-6)シリコンであること。
- (ウー7)金属酸化物であること
- (ウ-8)酸化チタンであること。

である。

[0083]

尚、本実施形態において遮光部は反射防止処理を施した金属より構成しても良い。このときの反射防止処理は酸化クロム、酸化シリコン、酸化アルミニウム等の金属酸化物層を積層したものとしている。

[0084]

図17(A)、(B)は本発明の回折光学素子を有した光学鏡筒の実施形態4の要部正面図と要部断面図である。

[0085]

本実施形態は、図1の実施形態1に比べて、回折光学素子1の基板の回折格子 1701のある面と反対側の面の周囲に、一定の幅の遮光部1703を設けた点 が異なっているだけであり、その他の構成は同じである。図中1702は鏡筒 (保持枠)である。

[0086]

本実施形態は回折光学素子1の基板の厚みが薄い場合や、光学系の瞳を回折光 学素子の近傍に配置する場合などに有効である。また、必要に応じて、両面の周 囲に遮光部を設けてもいい。

[0087]

本実施形態の回折光学素子の作製方法は実施形態1の図2から図5で示した、スパッター、レジスト塗布、パターニング、エッチング、レジスト剥離の工程を裏面に対して行っている。表面の回折格子面に損傷を与えなければ、回折格子面の加工後でも回折格子面の加工前でもよい。また、例えばカールズース社製の商品名「Suss MA25」のような両面アライメント付きの両面露光装置を使うことで表の回折面の中心と裏面の遮光部の中心を精度良く一致させて作製している。

[0088]

あとは図17に示すように、この回折光学素子1を鏡筒1702もしくはこれ に類する鏡筒に設置するのみである。鏡筒と回折光学素子の高精度な芯出しが要 求される場合には、鏡筒に設置する際に遮光部に設けたアライメントマークを利 用して鏡筒と回折光学素子の芯出しを容易にしている。

[0089]

図18(A)、(B)は本発明の回折光学素子を有した光学鏡筒の実施形態5の要部断面図である。尚、(A)は各要素1801,1802,1804の構成をわかり易くするための分解図である。

[0090]

本実施形態は、図1の実施形態1に比べ、回折光学素子1を回折格子を設けた格子部材1801と格子部材1801の周辺部に入射する光を遮光する遮光部1803を有する光学素子1804との独立した2つの部材を隣接し配置した点が異なっているだけであり、その他の構成は同じである。

[0091]

本実施形態では、薄い基板1805に大きな面積にわたり回折格子を加工して格子部材1801を作製する場合、平行平板より成る光学素子1804を張り合わせることで格子部材1801の自重変形などを低減している。また回折面を保護する作用もある。光学素子1804として、その上面に曲率を持たせることで、張り合わせ型の回折、屈折のハイブリッド型の光学素子を用いても良い。

[0092]

遮光部1803付きの平行平板1804は実施形態1の図2から図5で示した、スパッター、レジスト塗布、パターニング、エッチング、レジスト剥離の工程を平行平板に対して行う。図3のようにこの遮光部1803にアライメントマーク301を施し、格子部材1801に施したアライメントマークと合わせながら張り合わせを行うことで高精度で格子部材1801回折光学素子の光軸と平行平板1804の遮光部1803の中心とを合わせている。

[0093]

あとは図18のようにこの回折光学素子1を鏡筒1802もしくはこれに類する鏡筒に設置するのみである。鏡筒1802と回折光学素子1の高精度な芯出しが要求される場合には、鏡筒に設置する際に遮光部に設けたアライメントマークを利用して鏡筒と回折光学素子の芯出しを容易にしている。

[0094]

図19(A)、(B)は本発明の回折光学素子を有した光学鏡筒の実施形態6の要部断面図である。図19(A)は図18(A)と同じく分解図である。

[0095]

本実施形態は、図1の実施形態1に比べて、回折光学素子1を回折格子を設けた格子部材1901と平行平面より成る光学素子1904、そしてそれらの間に配置した格子部材1901の周辺部に入射する光を遮光する遮光部材1903の

3つの部材より構成した点が異なっているだけであり、その他の構成は同じである。1902は鏡筒(保持部材)である。

[0096]

本実施形態では、薄い基板1905に大きな面積にわたり回折格子を加工して格子部材1901を作製する場合、平行平板より成る光学素子1904を張り合わせることで格子部材1901の自重変形などを低減している。また回折面を保護する作用もある。光学素子1904として、その上面に曲率を持たせ球面や非球面とすることより、張り合わせ型の回折と屈折のハイブリッド型の光学素子が供給できる。

[0097]

遮光部材1903はブラックアルマイト処理をした金属薄板や、黒色の吸収部材による薄板、セラミック材料より成る吸収部材による薄板、あるいはマット面加工した金属薄板の中心に穴を加工したドーナツ状の薄板などの無機材料より構成している。尚、セラミック材料としてはTiC, TiN, ZrC, HfC, HfNのいずれか、又はその組み合わせを用いている。

[0098]

遮光部材1903に穴を加工する際に設けたアライメントマークを用いて、格子部材1901に遮光部材1903を光軸を合わせて貼り付け、更にその上に平行平板1904を張り合わせて鏡筒に全体を設置することで、図19(B)に示すのような回折光学素子1を構成している。

[0099]

次に本発明の回折光学素子の実施形態7について説明する。

[0100]

本実施形態の回折光学素子は、図1に示した回折光学素子1の遮光部分103を印刷によって設けている点が異なっているだけであり、その他の構成は図1の実施形態1と同じである。図10から図13のプロセス工程を経て形成された回折光学素子の基板1001に対して、アライメントマークを基準に印刷により遮光部分を設ける。印刷の方法としてはスクリーン印刷や、タンポ印刷、ホットスタンプ印刷等が有り、アクリル系またはエポキシ系などの遮光インクを数ミクロ

ンから数十ミクロンの厚みで印刷している。

[0101]

スクリーン印刷はインクを塗布する部分と塗布しない部分をスクリーン上のインクが染み込む部分と染み込まない部分で分け、このスクリーンを通してインクを転写する方法である。タンポ印刷はシリコンゴムにインクを吸わせ、基板に転写する方法で、ホットスタンプ印刷はフィルムについた遮光マスクを熱により転写する方法を用いている。

[0102]

このとき光は遮光塗料の下面すなわち基板との界面付近に照射されるため、こ こでの光照射によるアウトガスは表面より放出されにくくなっている。

[0103]

次に本発明の回折光学素子の実施形態8について説明する。

[0104]

本実施形態の回折光学素子は、図17に示した回折光学素子の遮光部分1703を印刷によって設けている点が異なっているだけであり、その他の構成は図17の実施形態3と同じである。図10から図13のプロセス工程を経て形成された回折光学素子の基板1001に対して、表面のアライメントマークを基準に基板の裏側に印刷により遮光部分を設ける。印刷の方法としてはスクリーン印刷や、タンポ印刷、ホットスタンプ印刷等が有り、アクリル系またはエポキシ系などの遮光インクを数ミクロンから数十ミクロンの厚みで印刷している。

[0105]

次に本発明の回折光学素子の実施形態9について説明する。

[0106]

本実施形態の回折光学素子は、図18に示した回折光学素子の遮光部分1803を印刷によって設けている点が異なっているだけであり、その他の構成は図18の実施形態4と同じである。張り合わせる基板側に印刷によって遮光部分1803を設けている。印刷の方法としてはスクリーン印刷や、タンポ印刷、ホットスタンプ印刷等が有り、アクリル系またはエポキシ系などの遮光インクを数ミクロンから数十ミクロンの厚みで印刷している。張り合わせる際には遮光部分18

03に印刷の際に、もしくは印刷後に設けたアライメント用マークにより格子部 材1801の光軸と張り合わせる平行平板1804の開口部の中心とを精度良く 合わせている。

[0107]

このとき光は遮光塗料に光が照射されても、光照射によるアウトガスは部材1904により抑え込まれる。

[0108]

図20(A)、(B)は本発明の回折光学素子を有した光学鏡筒の実施形態10の要部正面図と要部断面図である。

[0109]

本実施形態は、図1の実施形態1に比べて透過型回折光学素子の代わりに反射型回折光学素子である点が異なっているだけであり、その他の構成は同じである

[0110]

同図において、2001は回折格子を設けた格子部、2002は鏡筒、200 3は遮光部、φは格子部2101の有効口径、dは回折光学素子1の口径である

[0111]

次に、図20に示した反射型の回折光学素子1の作製方法の一例を説明する。図10から図13に示すように実施形態2で示した作製方法によりバイナリ型の格子部(回折光学素子)を作製する。この際、反射型の場合、透過型の回折光学素子とはエッチングの深さが異なるので、反射型の回折光学素子として最適化された深さをエッチングする。この後、スパッタリング法により、クロムを表面の全面に形成し、その上にスパッタリング法により酸化クロム等の誘電体層を形成する。その後、レジストを塗布し、格子部のみを露光して現像を行い、周辺部のみレジストが残る状態を形成する。次に反応性エッチングによって誘電体層のみをエッチングすることにより遮光部2103付きの反射型の回折光学素子1を作製している。金属層が施されている格子部分は反射率の高い反射型の回折光学素子として機能し、周辺の誘電体層が施されている周辺部は反射率の低い遮光部2

003として機能する。あとはこの回折光学素子1を図20の鏡筒2002もしくはこれに類する鏡筒に設置している。反射用の金属層としてはアルミ、白金、金、銀等を用いてもよい。また誘電体層はアルミナやSiO₂等を用いてもよい

[0112]

本実施形態の回折光学素子を光学系に用いると口径の大きい光束が入射しても 格子部に入射する光は反射と回折によって所望の波面を得られ、周辺部に入射す る光は遮光部によって遮光されるので迷光や不要光が発生しない回折光学素子と なっている。

[0113]

反射型の回折光学素子の周辺の遮光部は透過型の回折光学素子の遮光部と同様の作製方法で形成できるため、実施形態 1 から 9 の遮光部分の形成方法からコストや精度に応じて適したものを用いている。

[0114]

以上の各実施形態は回折光学素子について説明したが、回折光学素子の代わり にレンズ、プリズム等の光学素子においても同様に適用可能である。

[0115]

図21は本発明の回折光学素子を有した光学鏡筒をIC、LSI等の半導体デバイス、CCD等の撮像デバイス、液晶パネル等の表示デバイス等のデバイス製造用の工程のうちリソグラフィー工程において使用される投影露光装置に適用した実施形態11の模式図である。

[0116]

同図において、2101は光源を含む照明光学系、2102はレチクル、2103は投影光学系2108の鏡筒、2104はレンズ、2105は回折光学素子、2106はウエハ、2107はウエハステージである。回折光学素子2105は上記各形態のいずれでも適用でき、例えば実施形態1の回折光学素子の回折面の周辺部に遮光手段を設けたものである。ウエハステージ2107によってウエハ2106を所望の位置に位置決めし、不図示のフォーカス検出手段により、ウエハ高さをフォーカス位置に調整する。ここで、場合に応じて不図示の検出系に

よって、ウエハにすでに露光されている下のレイヤーのマークに対してレチクルをアライメントする。フォーカスとアライメントが完了したとき、不図示のシャッターを開き、光源2101からの照明光によってレチクルを照明し、レチクル2102の上のパターンを投影光学系2108によってウエハ2106の上に投影する。上記光源は、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザーなど波長250nm以下の紫外線を発する。

[0117]

そして、ウエハ2106を公知の現像処理工程を介してデバイスを製造している。尚、本発明に係る回折光学素子を有した光学鏡筒は画像形成用の光学機器や 照明用の照明装置等にも同様に適用することができる。

[0118]

また本発明によれば、遮光領域への光照射により発生するアウトガスが減り、レンズの曇等の問題が回避でき装置寿命が長くなる。

[0119]

【発明の効果】

以上の各実施形態によれば、光学素子を構成する遮光部を適切に設定することにより、不要光や錯乱光の発生が少なく、製作が容易でしかも光学性能を良好に維持することができる光学素子及びそれを有した光学系を達成することができる

[0120]

又、光学素子に所定の材質より成る遮光部を設けることで不要な透過光が発生 せず、従来のように鏡筒の口径と回折光学素子の有効口径を合わせる必要がなく なり、製造上の公差が緩くなる。また遮光部分を大きくとれば、周辺部の切削に よる異物などが光学素子に付着することも低減され、一方で設計、作製した回折 光学素子の全面を無駄なく回折光学素子として有効活用できる。

[0121]

又、遮光部分にアライメントマークを設けておけば、光学素子を鏡筒に高精度 に芯出しして設置することが要求される際にも有効利用できる。このマークは、 光学的には不要散乱光を発生しないので大変有効である。 [0122]

又、各実施形態の回折光学素子を露光装置に適応した場合、遮光手段は回折光 学素子の回折面上で回折部位の周辺を覆っているため、回折部位を通らない光は 遮光され、ウエハの露光に悪影響を及ぼすことがない。もちろん回折光学素子で あるためレンズの肉厚は通常のレンズより薄く、合成石英やホタル石等を材料に して作成することにより、ArFエキシマレーザーやKrFエキシマレーザーを 光源に使っても透過率が高く、露光効率が高い。

[0123]

また本発明によると、不要な透過光と散乱光を低減したので光学素子の半導体 デバイス製造用の露光装置への搭載を容易に実現でき、光学特性の高い投影光学 系が得られる。 又、KrFエキシマレーザーやArFエキシマレーザーなどの紫 外線を光源に用いても透過率が高く、レンズ硝材劣化の少ない投影光学系が得ら れる。

[0124]

また一方で、光学素子を用いた光学系の製作、組み立てを容易にしたため、本 発明は半導体デバイス製造用の露光装置に限らず、汎用の光学機器に広く応用す ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の回折光学素子の実施形態1の要部断面図

【図2】

本発明の回折光学素子の実施形態1の製造方法の途中工程を示す説明図 【図3】

本発明の回折光学素子の実施形態1の製造方法の途中工程を示す説明図 【図4】

本発明の回折光学素子の実施形態1の製造方法の途中工程を示す説明図 【図5】

本発明の回折光学素子の実施形態1の製造方法の途中工程を示す説明図 【図6】

2 5

- 本発明の回折光学素子の実施形態1の製造方法の途中工程を示す説明図 【図7】
- 本発明の回折光学素子の実施形態1の製造方法の途中工程を示す説明図 【図8】
- 本発明の回折光学素子の実施形態1の製造方法の途中工程を示す説明図 【図9】
- 本発明の回折光学素子の実施形態 1 の製造方法の途中工程を示す説明図 【図 1 0 】
- 本発明の回折光学素子の実施形態 2 の製造方法の途中工程を示す説明図 【図 1 1】
- 本発明の回折光学素子の実施形態2の製造方法の途中工程を示す説明図【図12】
- 本発明の回折光学素子の実施形態 2 の製造方法の途中工程を示す説明図 【図13】
- 本発明の回折光学素子の実施形態 2 の製造方法の途中工程を示す説明図 【図 1 4 】
- 本発明の回折光学素子の実施形態2の製造方法の途中工程を示す説明図 【図15】
- 本発明の回折光学素子の実施形態 2 の製造方法の途中工程を示す説明図 【図 1 6 】
- 本発明の回折光学素子の実施形態 2 の製造方法の途中工程を示す説明図 【図 1 7】
- 本発明の回折光学素子の実施形態4の要部概略図 【図18】
- 本発明の回折光学素子の実施形態 5 の要部概略図 【図 1 9 】
- 本発明の回折光学素子の実施形態6の要部概略図 【図20】
- 本発明の回折光学素子の実施形態10の要部概略図

【図21】

回折光学素子を用いた光学系である本発明の実施形態11の要部概略図 【図22】

従来の回折光学素子の説明図

【図23】

従来の回折光学素子の説明図

【図24】

従来の回折光学素子の説明図

【図25】

従来の回折光学素子の説明図

【図26】

従来の回折光学素子の説明図

【図27】

従来の回折光学素子の説明図

【図28】

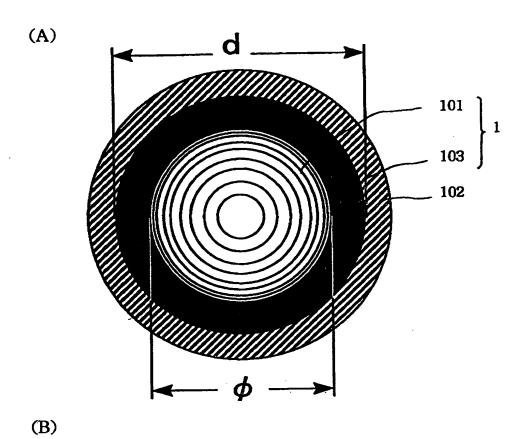
- 本発明の回折光学素子の実施形態3の製造方法の途中工程を示す説明図 【図29】
- 本発明の回折光学素子の実施形態3の製造方法の途中工程を示す説明図 【図30】
- 本発明の回折光学素子の実施形態3の製造方法の途中工程を示す説明図 【図31】
- 本発明の回折光学素子の実施形態3の製造方法の途中工程を示す説明図 【図32】
- 本発明の回折光学素子の実施形態3の製造方法の途中工程を示す説明図 【図33】
- 本発明の回折光学素子の実施形態3の製造方法の途中工程を示す説明図 【図34】
- 本発明の回折光学素子の実施形態3の製造方法の途中工程を示す説明図 【図35】

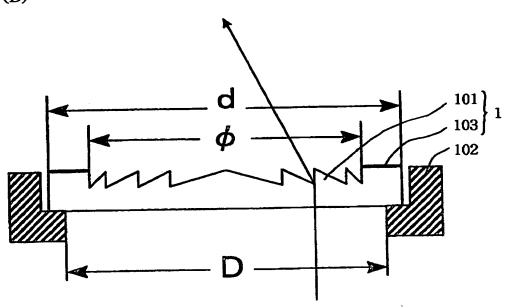
- 本発明の回折光学素子の実施形態3の製造方法の途中工程を示す説明図 【符号の説明】
- 101、1701、1801、1901、2001、2105 格子部
- 102、1702、1802、1902、2002 續筒
- 103、1703、1803、1903、2003 遮光手段
- 201、1001 基板
- 202、204、1405、1407 酸化クロム
- 203、1406
- 204 酸化クロム
- 301 アライメントマーク
- 401、601、701、1002、1003、1204、1501 レジストパターン
- 1904 隣接する平行平板
- 2101 光源部
- 2102 レチクル
- 2104 レンズ
- 2106 ウエハ
- 2107 ウエハステージ

【書類名】

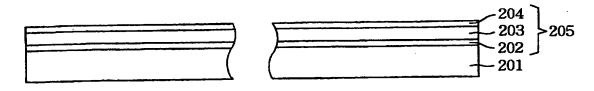
図面

【図1】

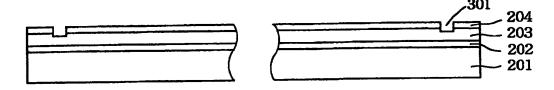




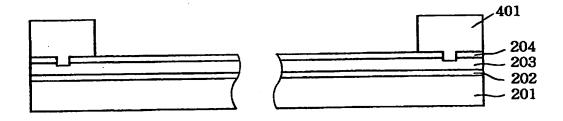
【図2】



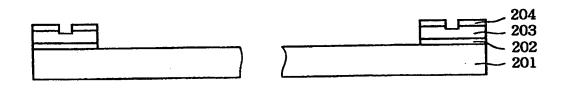
【図3】



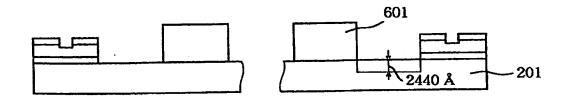
【図4】



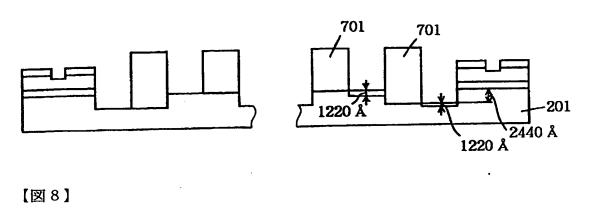
【図5】

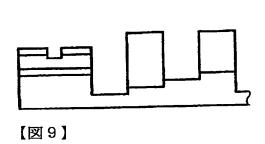


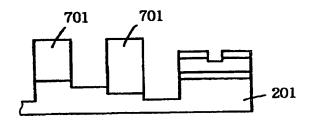
【図6】

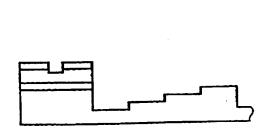


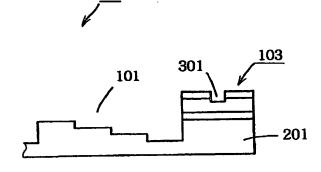
【図7】



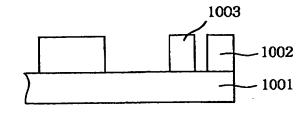




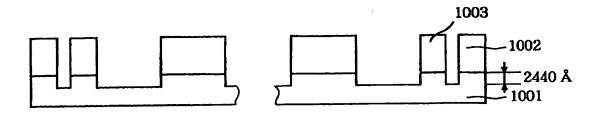




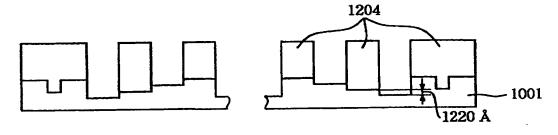
【図10】



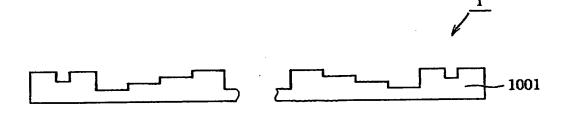
【図11】



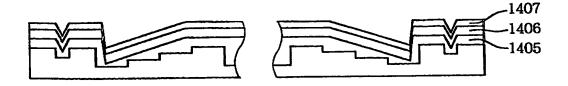
【図12】



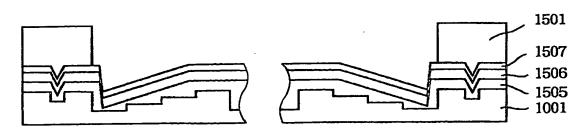
【図13】



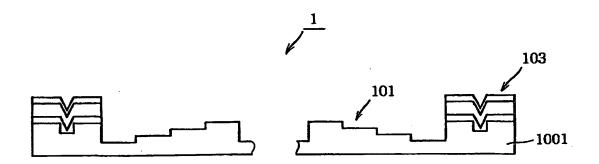
【図14】



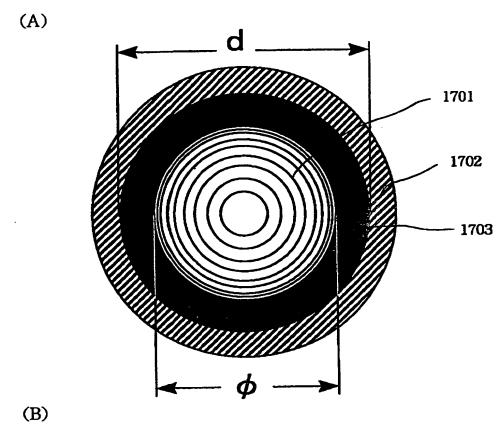
【図15】

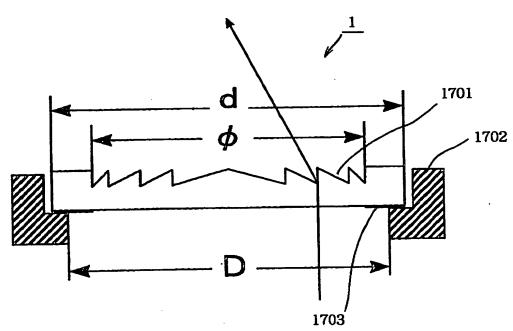


【図16】



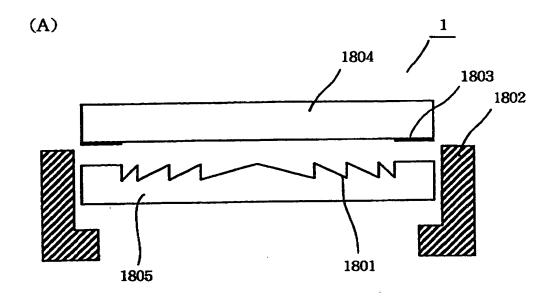
【図17】

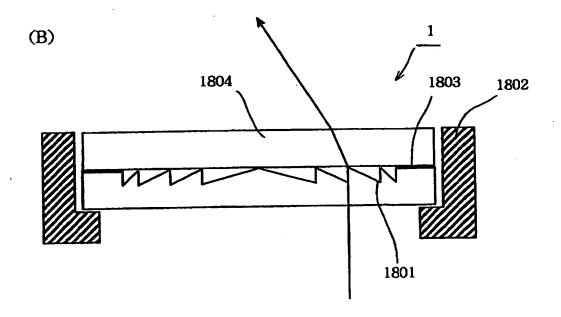




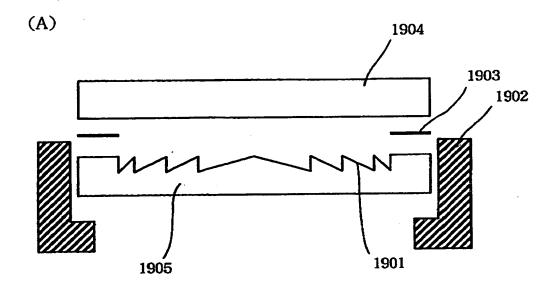
6

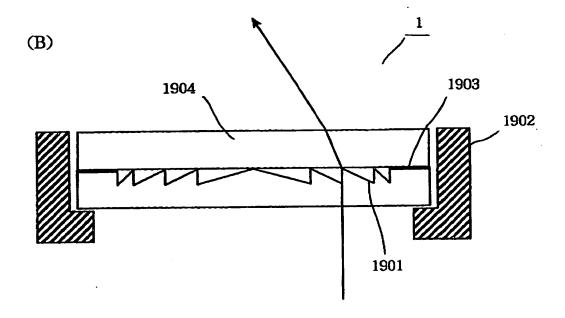
【図18】



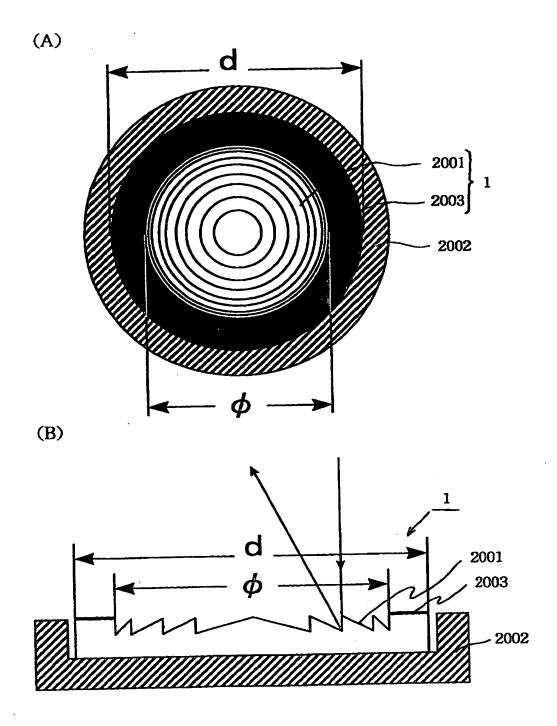


【図19】

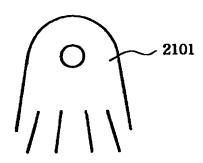


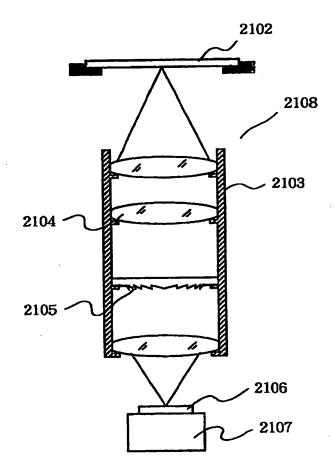


【図20】

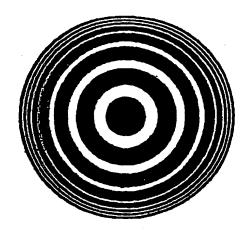


【図21】

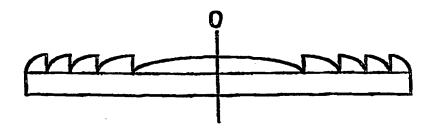




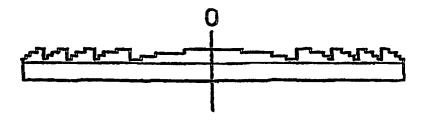
【図22】



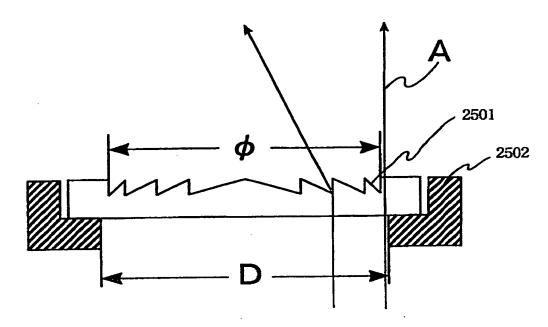
【図23】



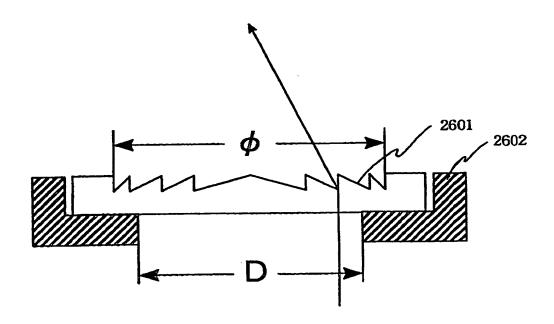
【図24】



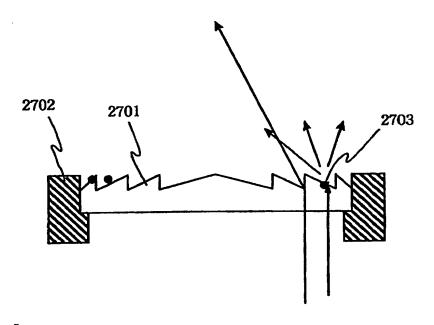
【図25】



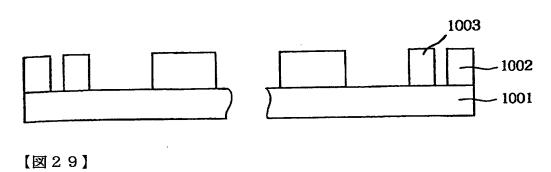
【図26】

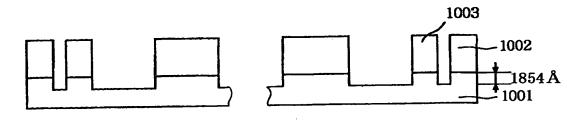


【図27】

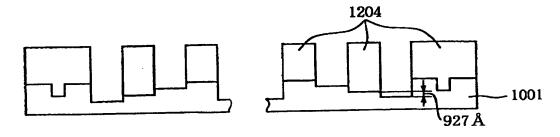


【図28】





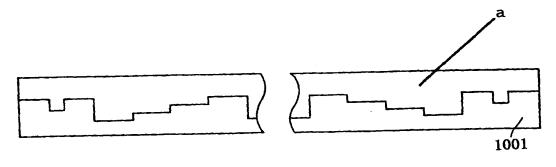
【図30】



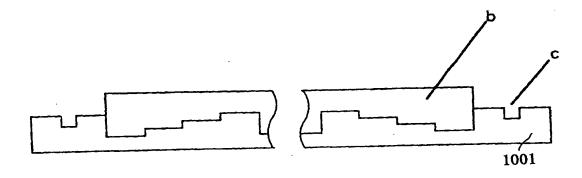
【図31】



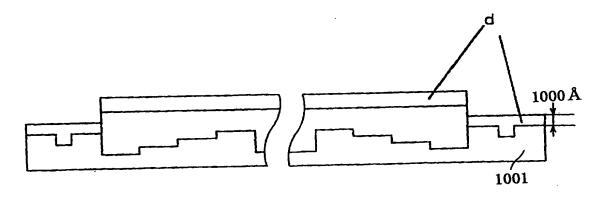
【図32】



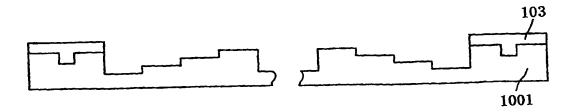
【図33】



【図34】



【図35】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 不要光や錯乱光を低減した製作が容易な回折光学素子等の光学素 子及びそれを用いた光学系を得ること。

【解決手段】 有効領域の周辺領域に、金属より成る遮光部を設けたこと。

【選択図】

図 1

認定・付加情報

特許出願の番号 平成11年 特許願 第255658号

受付番号 59900879081

書類名特許願

担当官 第一担当上席 0090

作成日 平成11年 9月16日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100086818

【住所又は居所】 東京都目黒区自由が丘2丁目9番23号 ラポー

ル自由が丘301号 高梨特許事務所

【氏名又は名称】 高梨 幸雄

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社